走査電子顕微鏡/熱画像カメラを用いた熱伝導特性評価技術の開発

Characterization technique of thermal conduction using SEM and IR-thermography

e-mail: ikeda.hiroya@shizuoka.ac.jp

【背景】熱電発電効率の向上のため、ナノ材料の導入が注目されている.しかしながら、マイクロ・ナノサイズの材料の熱電特性を評価することは、容易では無い.我々は、走査電子顕微鏡(SEM)と熱画像カメラを用いて、マイクロ・ナノサイズの熱電材料に適用可能な、熱伝導特性評価技術の構築を目指している.本研究では、直径 50µm のステンレスワイヤについて実測し、熱伝導率および熱拡散率を評価した結果について報告する.

【実験】図1に、本研究で構築した SEM / 熱画像 カメラ装置の概略を示す. SEM を使って試料の位 置を確認するとともに、電子線照射により試料加 熱を行なった.また試料温度の時間変化を,熱画 像カメラの動画として取得した.熱拡散率測定に は AC カロリメトリ法を用いており、周期的に加 熱するために、振動数 0.25Hz の方形波により電子 線照射位置を移動させた.測定試料として、直径 50µm,長さ 10mm のステンレス線 (SUS304)を 用いた.

【実験結果】電子線照射中のステンレスワイヤの熱 画像の一例を,図2に示す.ステンレスワイヤ内 の赤い部分に電子線が照射されており,そこから ワイヤに沿って,徐々に温度が低くなっている様 子がわかる.この結果は,SEMの電子線により, 試料の局所加熱が可能であることを示している.

電子線照射を開始後,温度が安定(定常状態)に なってから,周期的照射に切り替えたときの温度 変化を,図3に示す.この図には,電子線照射位置 からの距離が0~2mm まで0.5mm ごとのデータ をプロットしてある.電子線照射を開始するとス テンレスワイヤの温度が上昇し,定常状態に達す る.そのときの到達温度は,照射位置からの距離 が大きくなるほど低くなっている.熱回路と電気 回路を組み合わせたLTspiceシミュレーションに て解析したところ,電子線照射による温度の過渡 変化と到達温度のワイヤ内分布から,このステン レスワイヤの熱伝導率と熱容量が,バルクの値と 同じであることが示された.

さらにこのグラフから,周期的電子線照射によ り周期加熱が実現できていることがわかる.照射 位置からの距離と温度変化の時間遅れの関係から,



Fig. 1 Schematic of SEM/thermography system.



Fig. 2 Thermographic image of stainless wire.



Fig. 3 Time evolution of temperature as a parameter of distance from irradiated point.

熱拡散率が $2.8 \times 10^{-5} \text{ m}^2/\text{s}$ と見積られた. これは バルク値の約7倍であり、熱拡散率の計算に用い たモデルの妥当性を検討する必要がある.

本研究は、JST-CREST(JPMJCR19Q5)の助 成により遂行された。